AT-NO:

JP02002267403A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2002267403 A

TITLE:

INSIDE DIAMETER INSPECTION AND SEPARATION

SYSTEM FOR

CYLINDRICAL PART AND DEVICE THEREOF

PUBN-DATE:

September 18, 2002

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

YOSHIMURA, YASUO N/A
IYORI, TAKAO N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TAKESHIBA ELECTRIC CO LTD N/A SC MACHINEX CORP N/A

APPL-NO: JP2001064146

APPL-DATE: March 7, 2001

INT-CL (IPC): G01B005/00, G01B005/12, G01B021/00, G01B021/14,

G02B006/36

#### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To automate an <u>inspection for a ferrule</u> connecting an optical fiber to improve production efficiency.

SOLUTION: An <u>inspection tray 1a mounting the ferrule</u> 6 is arranged at a same

array as a conveyance tray and therewith the array pitch is made to a accuracy

standard for inspecting alignment as aligning jig, and each array of an

inspection device 2a consisting of pin gages 5a, b, a guide block 5c, referential pins 7a, b, light projecting parts 9a, b and light receiving parts

10a, b is aligned to the array of the inspection tray 1a and a lot of inspections are simultaneously executed with every array by progressively

transferring with aligning to the array pitch. After the inspections based on

inspection data of a control computer, a prescribed number of accepted ferrules

are mounted by removing rejected ferrules from the inspection tray laby a

transfer arm to replace the accepted ferrules, and the inspections are then completed.

COPYRIGHT: (C) 2002, JPO

4/2/06, EAST Version: 2.0.3.0

DERWENT-ACC-NO:

2002-745755

DERWENT-WEEK:

200281

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Internal diameter inspection/classification

system for

micro ferrule, measures internal diameter of

ferrule in

order for every sequence and unloads ferrule

<u>after</u>

inspection, depending on sequence pitch

PATENT-ASSIGNEE: SUMISHO KIDEN HANBAI KK[SUMIN] , TAKESHIBA DENKI

KK[TAKEN]

PRIORITY-DATA: 2001JP-0064146 (March 7, 2001)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 2002267403 A September 18, 2002 N/A

008 G01B 005/00

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP2002267403A N/A 2001JP-0064146

March 7, 2001

INT-CL (IPC): G01B005/00, G01B005/12, G01B021/00, G01B021/14,

G02B006/36

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2002267403A

**BASIC-ABSTRACT:** 

NOVELTY - The system has a tray (1) in which several **ferrules (6) to** be

inspected are mounted. The internal diameter of each ferrule is
determined in

order for every sequence and the ferrules are unloaded after inspection

depending on the sequence pitch.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is included for cylindrical shape

component device.

USE - For <u>inspecting internal diameter of micro ferrule</u> used for connecting

optical fibers used in communication system.

ADVANTAGE - Improves productivity. Internal diameter of ferrule can be

measured accurately.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the layout diagram of the internal diameter inspection system.

Tray 1

Ferrules 6

CHOSEN-DRAWING: Dwg.3/3

TITLE-TERMS: INTERNAL DIAMETER INSPECT CLASSIFY SYSTEM MICRO FERRULE

MEASURE

INTERNAL DIAMETER FERRULE ORDER SEQUENCE UNLOAD FERRULE

AFTER

INSPECT DEPEND SEQUENCE PITCH

DERWENT-CLASS: P81 S02 V07

EPI-CODES: S02-A01C; S02-A01C1; S02-A08; S02-A08A; V07-G10;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2002-587649

### (19)日本国特許庁 (J P)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-267403 (P2002-267403A)

(43)公開日 平成14年9月18日(2002.9.18)

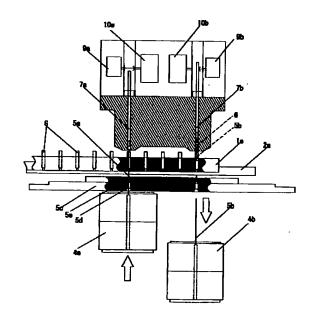
(51) Int.CL.		識別記号	FΙ			5	73-h*(参考)
G01B	5/00		G 0 1 B	5/00		Н	2F062
	5/12			5/12			2F069
	21/00		2	21/00		Н	2H036
	21/14		2	21/14			
G02B	6/36		G 0 2 B 6/36				
			審査請求	未請求	謝求項の数1	0 O	L (全 8 頁
(21)出願番号	<del>,</del>	特願2001-64146(P2001-64146)	(71)出顧人	593073252			
				株式会社	止タケシパ電視	ì	
(22)出顧日		平成13年3月7日(2001.3.7)			具相模原市田名	-	-31
			(71)出顧人	5911147	<b>'00</b>		
				住商マ	シネックス株式	会社	
					文京区大塚37		
		•	(72)発明者	吉村 島	集生		
				神奈川場	相模原市田名	3371	-31株式会社/
				ケシパ質		-	
			(74)代理人	1001079	62		
				弁理士	入交 孝雄		
							最終質に統

## (54) 【発明の名称】 円筒形状部品の内径検査・分別システム及び装置

## (57)【要約】

【課題】 光ファイバーを接続するフェルール等の検査を自動化し、生産効率を向上する。

【解決手段】フェルール6を搭載する検査用トレー1 a を搬送用トレーと同一配列とすると共に、位置合わせ治 具としてその配列ピッチを検査用位置合わせの精度規格 とし、ピンゲージ5a, b、ガイドブロック5c及び基準ピン7a, b、投光部9a, b、受光部10a, bからなる検査装置2aの各配列を上記検査トレーの配列に合わせて、配列ピッチに合わせた順送りによって配列ごとに同時に多数の検査を行う。検査後制御用コンピュータの検査データに基づき移載アームにより検査トレーから不良品を除去して合格品を入れ替えて所定数のフェルールを搭載して検査を完了する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 円筒形状部品を縦横に配列すると共にそ の配列ピッチが検査装置の位置合わせの公差規格を満た すトレーを検査装置にローディングし、該配列ピッチに 合わせた送り操作と、送り方向と直角方向の配列ピッチ に応じて配列された検査手段によって、列ごとに順次該 トレー上の円筒形状部品の検査を行い、検査後、円筒形 状部品をトレーに搭載した状態でアンローディングす る、内径検査・分別システム。

【請求項2】上記トレーを、ローダー/アンローダーエ 10 リアにおいて、直積みした所定数のロット単位としてロ ーディング/アンローディングすることにより連続的な 検査を行うことを特徴とする請求項1記載の内径検査・ 分別システム。

【請求項3】上記検査のデータにより自動移載手段を制 御して検査後の一定規格外の円筒形状部品を除去すると 共に一定規格内のもので補充することにより、トレー上 の円筒形状部品を所定数とすることを特徴とする請求項 1又は2記載の内径検査・分別システム。

【請求項4】上記円筒形状部品がフェルールであって、 上記検査が通り検査と止まり検査であり、上記送り方向 と直角方向にこれらの2種の検査手段を2列に配列し て、同時に2種類の検査を行うことを特徴とする請求項 1乃至3記載の内径検査・分別システム。

【請求項5】上記検査のデータにより複数の規格に応じ て検査後の円筒形状部品を分別してトレーに補充・搭載 することを特徴とする請求項1乃至4記載の自動検査シ

【請求項6】フェルール等の円筒形状部品を所定数配列 すると共にその配列ピッチが検査装置の位置合わせの公 30 差規格を満たすトレーを検査方向に該配列ピッチでステ ップ送りする送り手段、検査用ピンゲージを該送り方向 と直角方向の配列ピッチで配列すると共に、円筒形状部 品に対して上下相対移動可能とした検査手段、円筒形状 部品に対してピンゲージ先端をその配列ピッチに合致す る位置に規定するガイド孔を有するガイド手段、及びガ イド手段に相対して、上記検査手段のピンゲージにより 押圧される円筒形状部品の位置変化を検出するセンサー を設けてなる、フェルールなどの円筒形状部品内径検査 装置。

【請求項7】上記検査装置において、検査データに基づ いて検査済のトレーから所定の規格に応じて部品を抽出 し、それぞれの規格のトレーに補充・搭載する移載手段 を設けたことを特徴とするフェルールなどの円筒形状部 品内径検査装置。

【請求項8】上記検査装置を用いて、ピンゲージを予め ガイド手段の上記ガイド孔を挿通した状態におき、検査 後再びその位置まで戻すことによりピンゲージの摩耗を 低減するフェルールなどの円筒形状部品内径検査法。

搭載し、且つその配列ピッチを検査装置の位置合わせの 公差規格とし、下側には該円筒形状部品の配列ピッチに 合わせて円筒形状部品中心軸孔に望む開孔を設けた検査 トレー。

【請求項10】上記検査トレー上方を覆う天井と側壁及 び検査トレー周面に当接する側壁突部を有すると共にト レー外側壁面に接する垂下部とこれに嵌合する凹部を上 部に形成した、検査トレーカバー。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、光ファイバーを接 続するフェルールなどの微小な円筒形状の部品の内径検 査及び検査後の内径公差に応じた部品の選別における検 査精度及びその自動化による能率の向上に関する。

[0002]

【従来の技術】光ファイバーをコネクタで芯出した状態 に保持して接続するためのフェルールは、通常外径2. 499mm、内径125μmの微小な筒状部品であるが、 光ファイバーを接続する際の端面を整合する治具として 機能し、内径に僅かな誤差があっても光軸のずれとなっ て光ファイバーの光伝送損失に直接影響するため高い精 度を要求される。このため、フェルール内径は光ファイ バーの外径にあわせて厳密に規定され、また、僅かでも 小さい場合は光ファイバーを挿通固定できないから、こ れらの中心孔内径の仕上り精度は、一般に125μm以 上、126μ叫」下の範囲で用途に応じて厳しい要求が なされている。これらは工業的な製造設備の限界にある ため、製造後これらの一定の規格範囲の内径のものを内 径検査によって確認・選別する必要がある。

【0003】この内径検査には、フェルールの内径許容 誤差範囲の上下限値の寸法規格に高精度で合致するよう に製造されたピンゲージを用い、その通り径と止まり径 によって選別している。 これらの検査作業は、 フェルー ル自体が微小な部品であるうえ、細長いピンゲージの先 端の位置合わせが機械的にできないため、専ら手作業に よっている。すなわち、ピンゲージはフェルールの上記 の内径と長さ寸法にあわせたものであって、極めて細 く、それに比較して長さが大きいため、所定の外径寸法 の精度は満たすが、その長さに沿って本来的に存在する 微小な反りや曲がりの影響で保持具に設定した状態での 40 先端位置は中心軸に一致せず、離れてしまう。また、取 り扱いの便から径に対してその長さを十分に取ると、僅 かな振動によっても先端が振れるため、さらに取り扱い が困難となる。したがって、従来の機械的、自動的な位 置合わせの手段によってはフェルールの微小な中空軸に ピンゲージを挿通することは困難であった。また、ピン ゲージの通り径と止まり径の検出も通常の寸法・形状の 部品の場合と異なり、単純にゲージを当てるのみではな く、ゲージとピンとの接触の度合いを一定に保たないと 【請求項9】縦横に所定の配列ピッチで円筒形状部品を 50 測定値にばらつきが出るため、ピンゲージ挿入時のフェ

(3)

ルール内面との摩擦抵抗に対して一定の微小な負荷をかけて判定する必要があり、これを手作業で行うには検査者の熟練度などの要因も大きく、生産効率を向上することは困難である。

【0004】このため、フェルールの内径検査を自動化する試みがなされているが(例えば特開平10-197206号公報、特開平10-227619号公報など)、搬送トレーから取り出されたフェルールに対してピンゲージを一個ずつ精密に位置合わせを行ない、また、手作業に代わって内径ピンゲージをフェルール中空軸に挿入する際の摩擦抵 10 抗の度合いを計るため微小なバネの反発力を利用している。しかしながら、このような手段、方法では、生産効率を大きく向上することはできず、また、ばねを用いた判定法ではばねの反発力が負荷による変位量によって変化するため、特度を向上することが困難である。

【0005】さらに、最近の通信インフラの進歩・発展の実情から、光ファイバーと共にフェルールの大量の需要が見込まれているが、これに応じるため、フェルールの生産におけるいわばネックとなっているこれらの検査工程の生産性の向上と共に、一連の前後工程を含めた生20産性の向上、そのためのシステム構築が求められている。従来のこれらの検査のシステム,あるいはその延長上では例え検査工程自体が自動化されても、搬送トレーからフェルールを1個づつ取出して検査し、また、検査後に合格品や不合格品或いは検査規格に応じて再び選別・仕分けしてそれぞれの搬送トレーに搭載して次工程に移送し、出荷する工程を設けており、全工程からすると依然として工数が多くまた人手を要するものとなっているため、生産システム全体としての生産効率の向上は期待できない。30

【0006】一方、従来より部品としてのフェルールは、出荷時、搬送時などの検査の前後工程においても搬送トレー上に所定数整列した状態で一括して取扱われており、この形態で一貫して取り扱われることが、生産効率からも、またワークハンドリング手段などの取り扱いの利便性からも望まれる。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】フェルールなどの微小円筒形状部品の内径検査を自動的に確実に行うと共に検査結果に応じて選別・仕分けすることにより、効率的な40利用を可能とする。特に、このためのシステム及び検査装置において、搬送トレー上に所定数配列されたフェルールなどの部品の搭載形態を利用することによりこれらの検査・仕分け工程全体の効率化・生産性向上を可能とする生産システムを構築し、また、そのシステムに用いる検査装置及び検査方法を提供する。

### [0008]

## 【課題を解決するための手段】

【0009】本発明は、円筒形状部品を縦横に配列する と共にその配列ピッチが検査装置の位置合わせの公差期 50 格を満たすトレーを検査装置にローディングし、該配列 ピッチに合わせた送り操作と、送り方向と直角方向の配 列ピッチに応じて配列された検査手段によって、列ごと に順次該トレー上の円筒形状部品の検査を行い、検査 後、円筒形状部品をトレーに搭載した状態でアンローディングする、内径検査・分別システムであり、上記トレーを、ローダー/アンローダーエリアにおいて、直積みした所定数をロット単位としてローディング/アンローディングする連続的な検査を行い、また、上記検査のデータにより自動移載手段を制御して検査後の一定規格外の円筒形状部品を除去すると共に一定規格内のもので補充することにより、トレー上の検査後の円筒形状部品を所定数として検査結果を活用した効率的な取り扱いを可能とする。

【0010】また、上記円筒形状部品がフェルールであって、上記検査が通り検査と止まり検査であり、上記送り方向と直角方向にこれらの2種の検査手段を2列に配列して、同時に2種類の検査を行い、さらに上記検査のデータにより複数の規格に応じて検査後の円筒形状部品を分別してトレーに補充・搭載することによって、一層の効率化を達成できる。

【0011】また、フェルール等の円筒形状部品を所定数配列すると共にその配列ピッチが検査装置の位置合わせの公差規格を満たすトレーを検査方向に該配列ピッチでステップ送りする送り手段、検査用ピンゲージを該送り方向と直角方向の配列ピッチで配列すると共に、円筒形状部品に対して上下相対移動可能とした検査手段、円筒形状部品に対してピンゲージ先端をその配列ピッチに合致する位置に規定するガイド孔を有するガイド手段、30及びガイド手段に相対して、上記検査手段のピンゲージ

及びカイド手段に相対して、上記検査手段のピンゲージにより押圧される円筒形状部品の位置変化を検出するセンサーを設けてなる、フェルールなどの円筒形状部品内 径検査装置であり、さらに、上記検査装置において、検査データに基づいて検査済のトレーから所定の規格に応じて部品を抽出し、それぞれの規格のトレーに補充・搭載する移載手段を設けた構造を有する。

【0012】また、上記検査装置を用いて、ピンゲージを予めガイド手段の上記ガイド孔を挿通した状態におき、検査後再びその位置まで戻すことによりピンゲージの摩耗を低減するフェルールなどの円筒形状部品内径検査法である。

【0013】また、縦横に所定の配列ピッチで円筒形状部品を搭載し、且つその配列ピッチを検査装置の位置合わせの公差規格とし、下側には該円筒形状部品の配列ピッチに合わせて円筒形状部品中心軸孔に望む開孔を設けた検査トレー及び上記検査トレー上方を覆う天井と側壁及び検査トレー周面に当接する側壁突部を有すると共にトレー外側壁面に接する垂下部とこれに嵌合する凹部を上部に形成した、検査トレーカバーである。

#### 0 [0014]

する構成は、微小なフェルール中心軸孔に対するピンゲ ージの位置合わせを可能とすると共にピンゲージとフェ

でき、高い精度の検査が可能となる。また、上記の検査 手段により検査する際、ピンゲージを予めガイド手段か ら所定量突出させることにより、ピンゲージの位置合わ

ルール内径との摩擦力に釣合う負荷を一定とすることが せ操作におけるガイド手段の円錐状開孔との接触を抑制 し、その摩耗を大幅に低減することができる。 【0018】すなわち、ピンゲージは上記したようにそ の内径は高い精度を有しているが、極めて細く、微小な 反りや曲がりによって治具に取り付けられた状態でのゲ

ージ先端の位置は誤差があると共に、検査時の動きに伴 って振れの影響などが避けられない。このため、長いピ ンゲージをその下降させた待機位置から上昇させてガイ ド手段を挿通するには、ピンゲージの微細な反りや曲が りのため円錐状のガイド面に接触しつつ徐々に上昇させ てガイド手段上面から突出させて後、ワークに挿入しな ければならない。このときの接触圧は微小なものである が、ガイド自体が硬度の高い素材からなり、接触面積も

20 小さいため微細なピンゲージ先端の摩耗の影響はすこぶ る大きいものとなる。したがって、上記のように予めガ イド手段によって位置を設定した状態に保つことによ

り、ピンゲージの摩耗を大幅に低減できる。なお、この 突出した状態からワークへの位置合わせは、本発明の治 具としての検査用トレーのワーク位置精度によって十分

に保たれており、何ら問題ない。

【0019】また、検査用トレーと、ワークハンドリン グなどの要請から、ワークをトレー上面から所定高さに 突出させる必要があるが、この状態では検査用トレーを 30 重積するとトレー底面とワーク端面とが接触して端面が 汚染される虞があり、特に、フェルールなどのワークの 上面は光ファイバーの位置合わせの突合せ面となるた め、このような接触は避ける必要がある。本発明の検査 トレーのカバーはこのような要請に応えるもので、トレ 一周壁に重ねて支持され、ワーク上端面から間隔を設け て覆う構造とすることにより、ワーク端面を保護してト レーを多数重積することが可能となり、生産システム上 極めて有利である。

[0020]

【実施例】以下、図面を参照して、本発明の具体的内容 を説明する。図1は、本発明の検査装置の全体レイアウ トを簡略に示したものである。図のローディング/アン ローディングエリアAには、検査するためのフェルール を搭載した検査トレー1がトレーカバー3cを被覆した 状態 (図2参照) でトレー置き場1 a に移送され、その ままトレーカバーを介して直積みされる。検査トレー1 の構造は図2(a)、(b)に示すように、搬送用トレ 一などのハンドリング用のトレーからフェルールをその 搭載形態のまま移載できるように、その搭載形態に合わ

【発明の実施の形態】本発明は、検査に際して検査対象 となる部品を一個づつ個別に取り出して検査装置にセッ ティングし、位置合わせを行って検査を行うのではな く、検査装置の位置合わせの設定公差規格に合わせた精 度で部品を多数セットする治具をいわば検査用トレーと して創案することにより、多数の部品を高い精度で同時 に検査することを可能とする。そして、検査用治具をこ のような形態とすることにより、従来、部品の収容や各 種工程間の移送などの際の取扱の便を図るために用いら れていた搬送用トレーなどに配列されている部品を、そ のままトレーごと移載して部品をセッティングすること を可能とし、また、検査後も再び搬送トレーにそのまま 移載することが可能となるもので、多数の部品が搬送ト レーなどに搭載された形態のまま一貫して取り扱うこと が可能となる。無論、この検査に用いられるトレーを移 送・搬送などを行うトレーに使用してさらに一層の便を 図ることもできる。

【0015】このためには、検査装置のレイアウトは、 従来のものとは異なり、検査用トレーの配列、即ち搬送 トレーの配列に沿ったレイアウトを採ると共に検査用ト レーは検査部品のセッティング用治具としてその位置精 度の公差規格を満たす精密な配列ピッチを持たせる必要 があるが、本発明においては検査用トレーのこのような 治具機能によりセッティング精度を確保して検査装置に おける微小な円筒形状の部品の内径検査における固有の 位置合わせの課題を解決し、又一定の配列で搭載された 搬送トレーから移載可能であることから、生産システム 全体におけるワークハンドリングの整合性を持たせて、 利便性をはかり、併せて内径検査の自動化を可能とする ことにより生産性を大きく向上するものである。

【0016】このワークハンドリング上の利便は、搬送 用トレーなどから本発明の検査用トレーへの部品の移載 においても有利に発揮され、部品を搭載した搬送用トレ ーなどと本発明の検査用トレーを向かい合わせるのみで 容易に移載して、そのまま検査用治具としてのセッティ ングが完了することになる。円筒形状部品 (ワーク) の 上下の向きを搬送用トレーと同じとするには、単にその 操作を繰り返して行えばよい。また、検査後の検査用ト レーから搬送用トレーなどへの移載も同様に行うことが できる。

【0017】また、本発明の円筒形状部品内径検査装置 においては、検査時の位置合わせの治具として機能する 検査用トレーにより、トレー上の多数の円筒形状部品 (ワーク)をその配列ごとに同時にゲージとの位置合わ せが可能となり、生産性を著しく向上することができ る。さらに、本発明の検査装置におけるワーク端面の中 心軸孔にピンゲージを導く円錐状開孔からなるガイド手 段、ガイド孔内に配置され、中心軸孔に挿通するピンゲ ージにより押上げられるワークにより上昇する基準ピ ン、該基準ピンの上昇を検知することにより合否を判定 50 せてフェルールを立てて挿入する孔を縦横に配列して設 供給トレー2 bから検査済み合格品ワークを移載し、所

けてあり、通常その配列と搭載数は搬送トレーなどのハ ンドリング用のトレーと同じでよいが、その縦横の配列 ピッチを検査工程のゲージ挿入時の位置合わせに必要な 精度と規格で厳密に規定されている。 また、トレーカ バー3 cは、図2 (a)、(b)に示すように検査トレ 一上のワーク上部及び側部を覆う形状でその側壁には下 方に垂下部4 e を設け、側壁上縁部にはこれに対応する 凹部4 fが形成されており、その内壁には検査トレーの 側壁上縁に当接して支持される突部3 dが形成されてい る。このようなトレーカバーで被覆した検査トレーをト 10 レー置き場1 aに直積みする場合や単に検査トレーのカ バーとして用いる場合には、トレーカバー側壁の垂下部 4 eが検査トレー本体3 aの外側面に当接して位置ズレ することなく被覆し、側壁内面に形成された突部3 dが 検査トレー側壁上面に当接して、トレーカバー天井を検 査トレーに収容したフェルール上端面から一定間隔を保 持する。従って、この状態でトレーを直積みしても安定 に保たれ、フェルール端面が他のものに触れて損傷した り、汚染することを防止できる。また、検査トレーに搭 載したフェルール等のワークは、ワーク移載ワークなど 20 の取り扱いの便を図るためにトレーから一定高さに突出 しているため、トレーカバー側壁内面をこれらのワーク 配列の外周に接するようにすることにより、ワークとカ バー内面との間のがたつきを防止する構造とすることも できる。なお、この場合、トレーカバーの上記垂下部や 凹部を省略した形態とすることもできる。

【0021】検査トレーを検査のため移送する際には、 トレーカバーを移送アーム1 dにより隣接するトレーカ バー置き場1 bに移送して同じく直積みする。 トレーカ バーを図示するように側壁の垂下部4eと凹部4fとが 30 嵌合する形状とすると、何段にも積み重ねても安定して おり、ガイドなどの格別の支持手段を必要としない。ト レーカバーを除去した検査トレーは、移送アームによっ てトレー移載エリアBにおいて、検査ステージ2aに移 載される。検査ステージは、検査トレーと共に後述する 良品トレー2bを載せて、図の上下矢印方向に移送し、 内径検査装置2cを配置した検査エリアCに移送する。 検査エリアにおいて、検査トレーはワークの配列ピッチ に合わせて、1ピッチずつステップ送りされて、送り方 向に直角に配列されたワーク列毎に同時に検査を行う。 【0022】内径検査装置2cは、後述するように図の 検査ステージの移送方向と直角方向に通り検査及び止ま り検査用のピンゲージ列をそれぞれ検査トレー上のワー クの配列数に合わせて配列し、検査ステージの該フェル ールの配列ピッチに従ったステップ送りによって各列ご とに検査する。検査終了後、検査ステージ2aはワーク 移載エリアDに移動し、ワーク移載アーム2fによって 止まり不良ワークと通り不良ワークをそれぞれ制御コン ピュータの検査データによって止まり不良ワークトレー と通り不良ワークトレーに移載し、その後に前記の良品 50 られないから、基準ピン7aもそのままの位置にあっ

定数を充当する。 【0023】このように、検査後合格品のみのワークを 充当した検査トレーは、検査ステージによって検査トレ ー移載エリアBに移送され、トレー移送アーム1 dによ ってローディング/アンローディングエリアAの検査完 了品アンローディング位置1 c に移送されて検査を完了 する。この良品供給トレーは、先に検査終了後の良品の みとなった検査済みトレーを用いればよい。このよう に、検査結果を制御用コンピュータの検査データを利用 して、不良品ワークを検査種別若しくは規格別に仕分け てそれぞれのトレーに移載し、またその除去分を検査済 み良品から供給して充当することにより、これまで行っ ていた検査後のトレーに良品ワークを整理して充当する 作業を省き、また、検査不良の内容別に状況把握が容易 となり、不良品発生原因に対する対処が容易になる。さ らに、上記の例では検査を止まり検査と通り検査の2つ としているが、フェルールなどの精密部品では使用され る部位や用途によってその規格が必ずしも同じではな い。例えば、長距離の伝送に用いられる幹線と端末ユー ザーの機器周辺では光伝送の損失レベルに対する要求が 異なり、端末ユーザーなどではこれらの誤差に対する許 容度が大きい。従って、検査手段を上記の2つに留まら ず所定の許容誤差に応じた数の列として、これらの検査 結果により、それぞれの許容誤差条件を満たすワークを 選別・仕分けすることにより、効率的で、より一層無駄 のない検査を行うことができる。検査エリアCには、図 3に示すように検査トレー1aを積載した検査ステージ 2a下方にピンゲージ5a、5bを植設したゲージブロ ック4a、4bとその位置合わせを行うガイドブロック 5 c が設置され、また、上方には棒状基準ピン7a,7 bとその位置検出を行う投光部9a、9bと受光部10 a, 10bから構成されるセンサーが設置されている。 【0024】図において、検査トレー3 aはフェルール などのワーク6を平面上に縦横方向に配列しており、図 面に垂直方向にも多数配列している。止まり径検査と通 り径検査の2種類の検査用ピンゲージブロック4a, 4 bは、それぞれ図に垂直方向にワークと同数配列されて おり、アクチュエーターによりピンゲージ5a、5bを 図の矢印上下方向に移動してフェルール6の中空軸に挿 入する。ワークの内径検査時には図の左のゲージブロッ ク4aのようにアクチュエータにより上昇してピンゲー ジ先端をガイドブロック5 cのガイド部5 dにより誘導 して、ピンゲージ先端をフェルールの中空軸の位置に規 定するガイド孔5eに挿通して上方に突出する。 ピンゲ ージ先端は、さらに上昇してこの所定位置にステップ送 りされた検査トレー上のワーク6中空軸内を挿通する。 この例では、ピンゲージはフェルール上方に抜けて所定 位置にとどまり、フェルールはピンゲージにより押上げ

10

て、投光部9aと受光部10aからなるセンサーは作動。 しない。すなわち、止まり検査の場合は、不良品と判定 される。ガイドブロック5cの構造は、この図の例では 円錐状テーパーを2段に形成したガイド部5dを有し、 ピンゲージ5a、5bの先端を、この円錐状のガイド面 でフェルールの中空軸に対する位置合わせの基準位置と なる挿通孔5eに誘導する。

【0025】したがって、ガイドブロックによるピンゲ ージの基準位置に検査トレー上のフェルール中心軸の位 置が一致するようにフェルールの配列ピッチが規格さ れ、また、検査ステージのピッチ送り操作を行うことが できれば、フェルールにピンゲージを挿通する操作は自 動的におこなうことが可能となる。すなわち、本発明に おいては、検査トレーはこの位置合わせのための治具な のであって、従来の搬送用トレーなどと同様の配列で所 定数のフェルールを搭載することが望まれるが、その本 来の機能からすればその配列ピッチは上記のガイドブロ ックの位置規格に準拠する必要がある。なお、検査ステ ージのピッチ送り操作は、検査用や半導体加工用などの XYテーブルのように、高い位置精度を有するものが既に 20 実現されているので本発明においても検査ステージとし て採用できる。このように、位置合わせの治具としての 検査トレーとその位置合わせの規格に合わせてピンゲー ジの位置を規定するガイドブロックとの採用によって、 本発明においては検査トレー上のフェルールの各列ごと に配列されたピンゲージにより、ピンゲージの位置合わ せの課題を解決し、同時に多数のワークの検査を行うこ とができる。

【0026】図の例においては、止まり検査と通り検査 検査後、通り検査を通り検査ピンゲージ5bを同様にし てフェルールに挿通して行う。通り検査ではピンゲージ 5 b はフェルール内を挿通してフェルールを押上げるこ となく一定位置に停止する場合、基準ピンはその位置に とどまり、投光部と受光部からなるセンサーに検知され ず、合格品と判定される。また、ピンゲージがフェルー ル内を挿通できずに押上げると、上方の基準ピンが押上 げられて、該基準ピンが投光部の光を遭り、受光部によ り検知されて、不良と判定される。この基準ピンは、ピ ンゲージによって押上げられるフェルールに一定の荷重 40 を負荷することによって、ピンゲージとフェルール中空 軸内面との摩擦力の影響を相殺する必要があるが、本発 明においては、基準ピンに鍾としての作用を持たせるこ とによって、荷重一定の条件を得ることができる。実用 上は、微小な構造であるため十分な荷重を得るためスプ リングを併用することが好ましく、一定範囲までの荷重 をスプリングによって作用させることによって、荷重の 特性を好適な範囲とすることができる。

【0027】本発明においては、ピンゲージ先端位置を 検出して位置合わせの操作を行うことなく、上記のよう 50

に単純な操作によって各ピンゲージの配列毎にワークの 内径検査が可能であるが、各ピンゲージ先端がガイドブ ロックの上記の位置決めされたガイド孔5eに達するま での間、ピンゲージ先端がガイドブロックの円錐状のガ イド面に接触して折れないように微小な送り操作を繰り 返して上記の挿通孔に導く必要がある。すなわち、ピン ゲージは上記したように微小な反りや曲がりのためにそ れぞれの先端の位置は中心軸上にないが、このためガイ ド面に沿って上昇させるとガイドブロックの円錐状のガ イド面に接触し、そのまま上昇させると折れたりして損 傷することとなる。したがって、上記操作に際しては連 続的に送り操作をせず、ピンゲージ先端がガイド面に接 触しては離れる動きに合わせて微小な送り操作を繰り返 して、徐々に且つ慎重にピンゲージ先端をガイドブロッ クの上記ガイド孔に通す操作を行う必要がある。

【0028】このようにして、一旦ピンゲージ先端がガ イド孔を通ってガイドブロック上面に突出する基準位置 に導かれれば、上記の通り容易にフェルールにピンゲー ジを挿通することができる。したがって、上記のピンゲ ージを予めガイドブロックのガイド孔に挿通する操作を 行っておくことにより、その後は検査後のピンゲージの 下降操作の際に、図の右側のピンゲージブロック4 bの 下降位置まで戻さず、ピンゲージ先端をガイドブロック のガイド孔に挿通した状態とし、或いは上面より数mm 上方の検査トレーの送り操作や移送に支障のない高さ位 置とすることにより、これらの操作を省略することがで きる。その結果、大幅に作業効率を向上することができ る。また、このようなガイドブロックはセラミックのよ うな硬質材料で形成されるため、極めて硬度が高く、ピ のピンゲージをそれぞれ2列に配列したもので、止まり 30 ンゲージ自体も硬質の素材からなるが、先端部寸法も微 小であるためその接触圧はすこぶる高いものとなって、 このような接触操作を繰り返すことによる摩耗も激しい が、上記の操作法によることによって、ピンゲージの寿 命を大きく延長することができる。

[0029]

【発明の効果】以上説明したように本発明のフェルール 検査システムは、光ファイバーの接続に欠かすことので きない高精度のフェルールを安価かつ大量に供給するこ とを可能とするものであり、最近急速に進みつつある光 ファイバーによる情報通信システムの発展に伴なう光フ ァイバーの普及からする要請に応えて産業の発展に寄与 するものである。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の内径検査システムの全体をあらわすレ イアウト図。

【図2】本発明の内径検査システムに用いられる検査ト レー及びトレーカバー:斜視図(a)、部分断面図 (b)

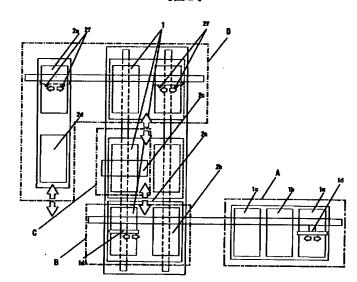
【図3】本発明の内径検査システムを構成する内径検査

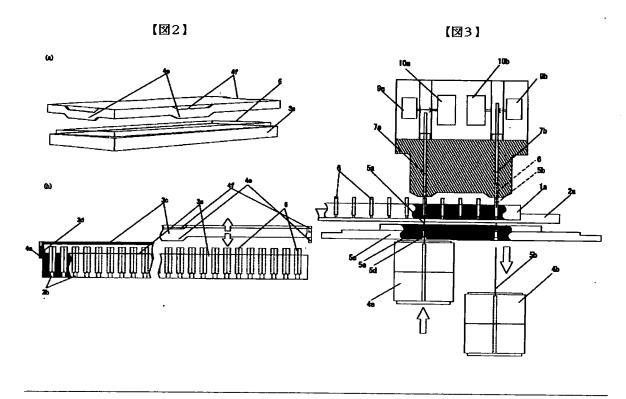
### 【符号の説明】

- 1 検査トレー
- 1a ローダートレー置場
- 1 b トレーカバー置場
- 1 c 検査完了品トレー置場
- 1 d トレー移送アーム
- 2a 検査ステージ
- 2b 良品供給トレー
- 2 c 内径検査装置
- 2d 通り不良ワークトレー
- 2e 止まり不良ワークトレー
- 2f ワーク移載アーム
- 3a 検査トレー本体
- 3 b 開口
- 3c トレーカバー
- 3 d 突部
- 4 e 垂下部
- 4 f 凹部
- 4a 止まり検査用ピンゲージブロック
- 4 b 通り検査用ピンゲージブロック

- 5a 止まり検査用ピンゲージ
- 5b 通り検査用ピンゲージ
- 5c ガイドブロック
- 5 d ガイド部
- 5e ガイド孔
- 6 フェルール
- 7a 止まり検査用基準ピン
- 7 b 通り検査用基準ピン
- 8a 止まり検査用センサーブロック
- 10 8 b 通り検査用センサーブロック
  - 9 a 止まり検査用投光部
  - 9 b 通り検査用投光部
  - 10a 止まり検査用受光部
  - 10b 通り検査用受光部
  - 12a 止まり検査列
  - 12b 通り検査列
  - A ローダー/アンローダーエリア
  - B 検査トレー移載エリア
  - C 検査エリア
- 20 D ワーク移載エリア

### 【図1】





フロントページの続き

(72)発明者 伊従 孝夫

神奈川県相模原市田名3371-31株式会社タケシバ電機内

Fターム(参考) 2F062 AA34 BB04 BC80 CC23 CC27

EE01 EE66 FG01 FG07 FG08

GG26 GG71 HH14 MM02 MM13

MM16 NN02 NN04

2F069 AA40 BB40 CC02 DD15 DD16

GG01 GG04 GG07 GG51 GG67

GG78 HH30 LL03 LL06 MM02

MM04 MM34 PP02 PP07 QQ03

QQ05

2H036 QA20